

RAYOS X

- 1.- Geometría de cristales. Retículos bidimensionales; retículos de traslación; retículos tridimensionales. Retículos de Bravais. Grupos de puntos; grupos espaciales. Simetría macroscópica y microscópica.
- 2.- Naturaleza de los rayos X. Producción de rayos X. Radiación continua y característica. Principales tipos de tubos de rayos X. Longitudes de onda de los rayos X. Refracción y absorción de los rayos X. Límite Duane-Hunt. Elección de la radiación.
- 3.- Difracción de rayos X. Geometría de difracción. Difracción por una fila de átomos. Difracción por un retículo cristalino. Condiciones de difracción de Laue. Ley de Bragg. Ordenes de difracción. Retículo recíproco. Relación de los espacios interplanares con la geometría de la celda.
- 4.- Métodos de cristal único. Película plana y cilíndrica, película fija y movable. Diagramas de cristal giratorio. Orientación de cristal según un determinado eje de giro (eje cristalino o línea de retículo). Determinación del período de identidad. Determinación de los índices, diversos métodos, uso de la carta Bernal. Diagramas de oscilación. Relación con la simetría cristalina. Ley de Friedel.
- 5.- Método Debye-Scherrer. Tipos de cámaras. Geometría de las cámaras. Diferentes posiciones de la película con respecto al haz de rayos X. Medi-

Aprobado por Resolución DT. 532/77


DR. RAUL AZARDINI
DIRECTOR
DPTO. DE CS. GEOLÓGICAS

ción de los ángulos de Bragg. Determinación de los espaciados d. Colocación de índices en el sistema cúbico; métodos gráficos y analíticos. Determinación de la celda unidad. Colocación de los índices en el sistema tetragonal y hexagonal; métodos gráficos y analíticos. Colocación de los índices en los sistemas rómbico y monoclinico.

- 6.- Determinación precisa de las constantes reticulares. Errores en la medición de los espaciados d, absorción y refracción. Errores sistemáticos. Métodos precisos de medición. Método de Straumanis. Métodos de extrapolación.
- 7.- Intensidad de difracción. Intensidad absoluta y relativa. Factores que afectan la intensidad de difracción; factores geométricos; factores ffsicos. Medición de intensidades; por fotometría y por estimación visual. Escalas de intensidad y su preparación. Efectos especiales de difusión y difracción.
- 8.- Identificación de sustancias por el método del polvo. Análisis cualitativo. Determinación de fases mineralógicas. El sistema ASTM y su aplicación práctica. Alcances y límites del método.
- 9.- Difractometría de contador. Principios y usos del método. Principio geométrico del goniometro de difracción; sistema de colimación. Tubos detectores; tubo Geiger-Müller. Técnica de registro y de contador. Preparación de la muestra.
- 10.- Análisis cuantitativo; aspectos generales. Alcances y límites del método. Mezclas de dos componentes; mezclas de n componentes. Método de las


DR. RAUL A. ZARDINI
DIRECTOR
DPTO. DE CS. GEOLÓGICAS

Aprobado por Resolución DT. 532/77

adiciones conocidas. Método del standard interno. Preparación de patrones y de la curva de calibración.

11.- Identificación de arcillas mediante difracción. Principios en que se basa. Principio fundamental de la estructura cristalina de los minerales arcillosos; silicatos laminares. Sistemática de los silicatos de Friedrich Liebau.

12.- Identificación de los minerales arcillosos : grupos de los caolines; montmorillonitas; micas; cloritas. Preparación de las muestras; muestras orientadas y no orientadas. Análisis cuantitativo; alcances y límites del método.



DR. RAUL A. ZARDINI
DIRECTOR
DPTO. DE CS. GEOLOGICAS

Aprobado por Resolución DT. 532/77